

بناء منظومة رش كيميائي حراري لتحضير المواد الصلبة على شكل أغشية رقيقة ودراسة الخواص الفيزيائية للمواد المحضرة.

صالح حسون عبود

عادل حبيب عمران

كلية العلوم جامعة الكوفة

الخلاصة:

يتضمن المشروع بناء منظومة لتحضير الأغشية رقيقة thin films لمختلف المواد الصلبة وبطريقة الرش الكيميائي الحراري (Chemical spray pyrolysis). هذه الأغشية ذات استقرارية وثبات عاليين في الخصائص الفيزيائية للمواد المحضرة منها، لذلك تكون معتمدة النتائج لأغراض البحوث والدراسات. حيث تم تحضير أغشية أكسيد النيكل NiO وأغشية كبريتيد الكاديوم CdS الرقيقة بهذه الطريقة. وتمت دراسة الخصائص البصرية للأغشية المحضرة في المنطقة المرئية – فوق البنفسجية UV- VIS من الطيف الكهرومغناطيسي من خلال تسجيل طيف الامتصاصية والنفاذية للأغشية المحضرة في مدى الأطوال الموجية (300-1100) nm. أطيف الانعكاسية للأغشية المحضرة درست أيضاً في نفس المنطقة. الثوابت البصرية للأغشية المحضرة مثل معامل الامتصاص ومعامل الخمود ومعامل الانكسار حسبت من تلك الأطياف. الأغشية المحضرة وجدت أنها ذات فجوة طاقة مباشرة وقيمة طاقة الفجوة الممنوعة لأغشية NiO هي 3.694 eV بينما قيمتها لأغشية CdS هي 2.471 eV.

Abstract:

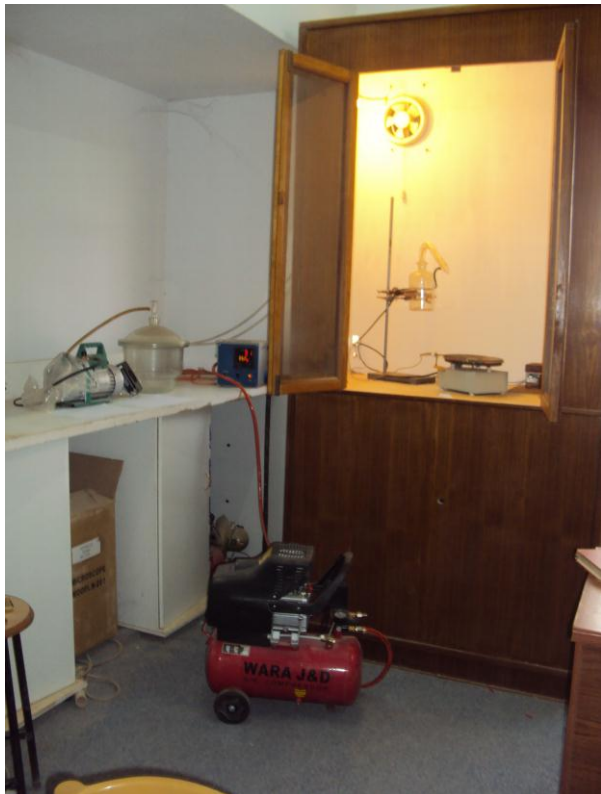
The project includes building a system for the preparation of thin films various solids by chemical spray pyrolysis method.

These films stability and reliability of prohibitively high in the physical properties of materials prepared from them, to be supported by the results for the purposes of research and studies.

Nickel oxide NiO and cadmium sulfide CdS thin films were prepared using this method. The optical properties of prepared films have been studied in the UV-VIS region of the electromagnetic spectrum by recording of absorbance and transmittance spectrum of the wavelengths range (300-1100) nm. Reflectivity spectra of the prepared prepared films in the films were also studied in the same region. Optical constants of the prepared films, such as absorption coefficient, extinction coefficient and refractive index calculated from these spectra. The prepared films were found to be of direct energy gap and the value of the forbidden energy gap of the NiO films is 3.694 eV while the value of the CdS films is 2.471eV.

المقدمة:

هواء مضغوط ليخرج من فتحة الأنبوبه الخرجيه السفلى
محيطا بجوانب فتحة الأنبوبه الشعريه .
والشكل(2) يوضح أجزاء جهاز الرش .



شكل (1) منظومة الرش الكيميائي الحراري بكافة
أجزائها.



شكل (2) جهاز الرش الزجاجي .

تعتبر طريقة الرش الكيميائي الحراري من الطرق المهمة والمعتمدة في تحضير الأغشية الرقيقة وخاصة في التطبيقات الفوتوفولتائية التي تتطلب مساحات واسعة من أغشية المواد الرقيقة. وتمتاز هذه الطريقة عن الطرق الأخرى بأنها اقتصادية لقلّة التكاليف وبساطة الأجهزة المستخدمة, ويمكن تحضير أغشية وبمساحات أكبر مما توفره الطرق الأخرى وأن الأغشية المحضرة لها استقرارية عالية في صفاتها الفيزيائية مع مرور الزمن . وتحضر بهذه الطريقة أغشية رقيقة لمركبات ذات درجات انصهار عالية قد يصعب تحضيرها بالطرق الأخرى , كما يمكن تحضير أغشية من مزج مادتين أو أكثر لها درجات انصهار مختلفة [1,2].

أكسيد النيكل NiO مادة شبه موصله ذات فجوة طاقة عريضة ومباشره , ومهمة جدا بسبب استقرارها الكيميائي الممتاز بالإضافة الى ماتمتاز به من خصائص بصريه وكهربائيه ومغناطيسيه, حيث استخدمت كمادة ضديدة الفير ومغناطيسيه , وهو من المواد التي يتغير لونها عند تسليط مجال كهربائي عليها (Electrochromic material) ويستخدم بشكل واسع في النوافذ الذكية وفي مرايا السيارات الخلفية (car rear-view mirrors) بالإضافة الى استخدامه كورقه الكترونيه (e-paper) في أجهزة العرض المتحركة ذات الدقة العاليه [3,4,5].

أما كبريتيد الكاديوم CdS فهو مادة شبه موصله ذات فجوة طاقة مباشره ايضا وتستخدم بشكل كبير في التطبيقات الكهروضوئيه (optoelectronic) كالكواشف الضوئيه والخلايا الشمسيه وفي ترانزستورات الأغشية الرقيقة [6,7].

الجانب العملي:**أولاً: منظومة الرش الكيميائي الحراري:**

تم بناء منظومة تحضير وترسيب الأغشية الرقيقة وبتقنية الرش الكيميائي الحراري وهي من الطرق الكيميائيه لتحضير الأغشية الرقيقة . وتتألف المنظومه من عدة اجهزه رتبّت بحيث يتم الاستفادة منها في تحضير أغشية رقيقه وعلى قواعد مختلفه. والشكل (1) يوضح المنظومه بكافة اجزاؤها . وتتكون المنظومه من الأجهزة الآتية:

1. جهاز الرش :

وهو جهاز مصنع من الزجاج الأعتيادي يحتوي على خزان يستوعب 300 ml توضع فيه المحاليل المراد رشها , متصل من اعلاه بأنبوبه في نهايتها أنبوبه شعريه قطرها 1 mm تقريبا محاطه بأنبوبه أخرى أكبر قطر منها بحيث تكون فتحتا الأنبوبتين بمستوى أفقي واحد وبمركز واحد , وترتبط الأنبوبه الخارجيه بفتحه جانبيه يمر من خلالها

4. مضخة الهواء:

تستخدم مضخة الهواء لدفع هواء مضغوط داخل الأنابيب المحيطة بالأنابيب الشعريه عن طريق الفتحه الجانبيه , بحيث يخرج تيار الهواء بضغط معين يؤدي الى سحب المحلول من خزان جهاز الرش عن طريق الأنابيب الشعريه الى سطح القاعده الساخنه على هيئة رذاذ بشكل مخروط قاعته الى الأسفل ورأسه نهاية الأنابيب الشعريه , وللمضخة منظما يتحكم بضغط الهواء الداخل بين انابيب جهاز الرش . والشكل (5) يبين مضخة الهواء .



شكل (5) مضخة الهواء المضغوط .

5. مضخة التفريغ : Rotary pump

لغرض الحفاظ على النماذج المحضرة من التلف بسبب الشوائب المختلفه الموجوده في جو المختبر, توضع النماذج بعد التحضير في حاويه زجاجيه ذات غطاء محكم مرتبطه من الأعلى [انبوب مزود بصمام لغلاق وفتح الحاويه والتحكم بتفريغ الحاويه من الهواء بواسطة مضخة التفريغ . والشكل (6) يبين مضخة التفريغ وحاوية النماذج

والجدير بالذكر هنا انه يتم التحكم بعملية الرش للسائل الموجود داخل جهاز الرش من ناحيه زمن الرش وكذلك الفتره الزمنيه ما بين رشه و أخرى , حيث زودت المنظومه بموقت الكتروني يتحكم بضخ وإيقاف ضخ الهواء الى جهاز الرش . حيث نحتاج بعد كل رشه للمحلول على القاعده الساخنه الى فترة توقف لتستعيد القاعده درجة حرارتها التي تنخفض بسبب رش المحلول البارد عليها .

2 . السخان الكهربائي

: لغرض رفع درجة حرارة القاعدة (التي يرسب عليها الغشاء الرقيق) يتم استخدام سخان كهربائي (Hot plate) تتراوح درجة حرارته بين $80-700^{\circ}\text{C}$.

3 . الترمومتر والمزدوج الحراري :

لمعرفة درجة حرارة سطح القاعده يستخدم مزدوج حراري Thermocouple يتكون من مجس حراري حساس يوضع على سطح القاعده ويتصل بعدد رقمي يؤشرمقدار درجة الحرارة بالدرجات المؤيه أي ترمومتر Thermometer . الشكل (3) يبين السخان الكهربائي والمزدوج الحراري . والشكل (4) يبين الترمومتر والمسيطر الحراري .



شكل (3) السخان الكهربائي والمزدوج الحراري .



شكل (4) الترمومتر والمسيطر الحراري .

2. ترسيب الأغشية الرقيقة :

حضرت الأغشية الرقيقة لأوكسيد النيكل وكبريتيد الكاديوم على قواعد زجاجية (cover glass) مصنوعة من زجاج البوروسليكات لايتجاوز سمكها (0.1mm) , بعد ان تنظف بشكل جيد بعدة مراحل . حيث تغسل بالماء العادي موسحوق التنظيف لأزالة الأوساخ التقليديه , ثم تغسل بالماء المقطر (distilled water) , واخيرا تغمر في كأس يحتوي على الأيثانول (كحول الأثيل C₂H₅OH) لأزالة أي أثار دهنيه عالقه , بعدها تجفف جيدا بتيار هوائي ساخن بالمجفف الهوائي (Blower) .



شكل (6) مضخة التفريغ وحاوية النماذج .

ولتحضير أغشية NiO يرش محلول نترات النيكل المائي بشكل رذاذ على القواعد الزجاجية المسخنة بدرجة 225 °C يحدث تفاعل بين ذرات المادة على القاعدة الزجاجية الساخنة بفعل الحرارة فتترسب مادة أوكسيد النيكل على سطح القاعدة وفق التفاعل الكيميائي الآتي:



كما حضرت أغشية CdS على نفس النوع من القواعد الزجاجية المسخنة بدرجة حراره 350 °C برش مزيج محلول نترات لكاديوم المائي ومحلول الثايوريا بشكل رذاذ على القاعدة الزجاجية الساخنة يحد التفاعل بفعل الحرارة وتترسب مادة كبريتيد الكاديوم على سطح القاعدة وفق التفاعل الكيميائي الآتي:



كانت الأغشية المحضرة لأوكسيد النيكل بسمك 1451.8 أنكستروم وبلون غامق , اما أغشية كبريتيد الكاديوم فكانت بسمك 1350 أنكستروم ولون اصفر .

ثالثا: الفحوصات البصريه :

أطياف الأمتصاصيه والنفاذيه للأغشية المحضره سجلت في المنطقه المرئيه – فوق البنفسجيه UV-VIS باستخدام جهاز قياس الطيف من نوع shimadzu 157 UV-VIS spectrophotometer في مدى الأطوال الموجيه (300-1100)nm .

النتائج والمناقشه:

الأشكال (7,8) تبين أطياف النفاذيه لأغشية NiO و CdS على التوالي , ومن الشكل (7) نلاحظ ان نفاذيه الغشاء أكبر من 40% عند الأطوال الموجيه الأكبر من 350 nm , ومن الشكل نلاحظ ان النفاذيه تزداد مع زيادة

ثانيا : تحضير الأغشية الرقيقة :

1 . تحضير المحاليل:

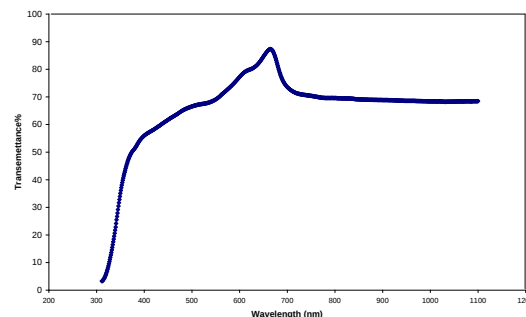
أ. تحضير المحلول المستخدم في تحضير أغشية أوكسيد النيكل NiO :

لتحضير أغشية أوكسيد النيكل NiO استخدمت مادة نترات النيكل المائي Ni(NO₃)₂.6H₂O وهي ماده صلبه على شكل مسحوق أسود اللون ذات وزن جزيئي (290.81) لتحضر محلول ماده بتركيز 0.05 M وذلك بإذابة 1.8175 gm من نترات النيكل المائي في 250 ml. من الماء المقطر بأستخدام خلط زجاجي اولا ثم خلط مغناطيسي لمدة 15 دقيقه لضمان التجانس , ثم يترك المحلول في قنيتيه حجميه لمدة 24 ساعه للتأكد من عدم وجود رواسب أو عوالق فيه وضمان تجانس المحلول تماما .

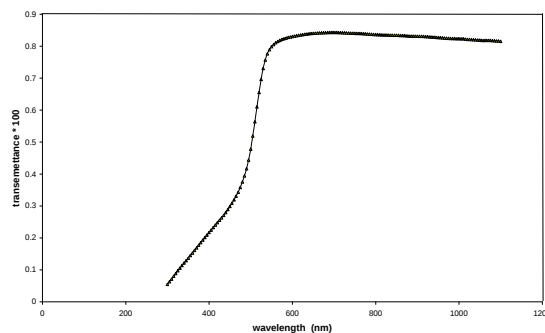
ب: تحضير المحلول المستخدم في تحضير أغشية كبريتيد الكاديوم CdS:

لتحضير أغشية كبريتيد الكاديوم CdS أستخدمت ماده نترات الكاديوم المائي Cd(NO₂). 4H₂O وهي ماده صلبه على شكل مسحوق أبيض اللون ذات وزن جزيئي 308.47 لتحضير محلول ماده بتركيز 0.05 M وذلك بإذابة 3.8558 gr من نترات النيكل المائي في 250 ml. من الماء المقطر بأستخدام الخلط الزجاجي والخلط المغناطيسي لمدة 15 دقيقه , وأستخدمت ماده الثايوريا (NH₂)₂CS وهي ماده صلبة على شكل مسحوق ابيض اللون ذات وزن جزيئي 76.12 لتحضير محلول ماده بتركيز 0.05 M وذلك بإذابة 0.9515 gm من الثايوريا في 250 ml. من الماء المقطر بأستخدام الخلط الزجاجي والخلط المغناطيسي لمدة 15 دقيقه . ويترك المحلولين لمدة 24 ساعه لضمان التجانس للمحلولين والتأكد من عدم وجود الرواسب والعوالق . وبمزج نسب حجميه متساويه من المحلولين نحصل على المحلول الخاص لتحضير أغشية CdS .

الطول الموجي وهو سلوك مشابه لسلوك طيف النفاذية لأغشية NiO المحضرة بتقنيات مختلفه والمسجله في دراسات سابقه [3,5]. ومن الشكل (8) نلاحظ ان نفاذية غشاء CdS هي أكبر من 50% عند الأطوال الموجيه الأكبر من 500 nm وانها تزداد بزيادة الطول الموجي وهذا السلوك يتطابق مع سلوك أغشية CdS المحضر بتقنيات أخرى [5,8].

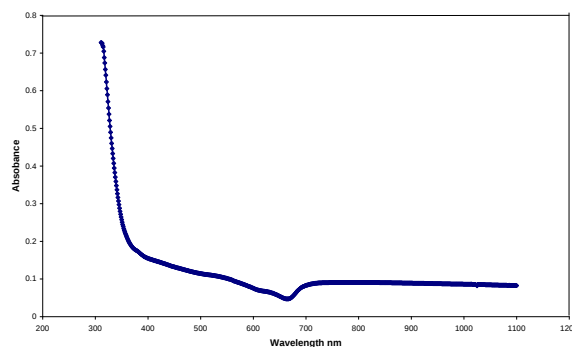


الشكل (7) طيف النفاذية لغشاء NiO .

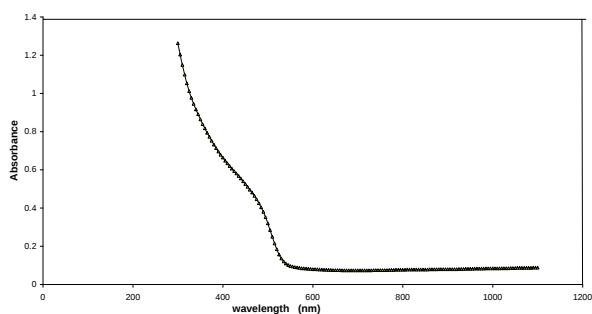


شكل (8) طيف النفاذية لغشاء CdS .

أطياف النفاذية لأغشية NiO و أغشية CdS المبينه بالأشكال (9,10) على التوالي تظهر ان أمتصاصية غشاء NiO منخفضة في المنطقه المرئيه وتحت الحمراء القريبه عند الأطوال الموجيه من (400-1100) nm في حين ان قيمها مرتفعه عند الأطوال الموجيه المرئيه القريبه من المنطقه فوق البنفسجيه. كما نلاحظ من الشكل (10) ان امتصاصية غشاء CdS منخفضة أيضا في المنطقه المرئيه وتحت الحمراء القريبه عند الأطوال الموجيه من (500-1100) nm في حين أنها مرتفعه في المنطقه فوق البنفسجيه .



شكل (9) طيف الأمتصاصيه لغشاء NiO .



شكل (10) طيف الأمتصاصيه لغشاء CdS

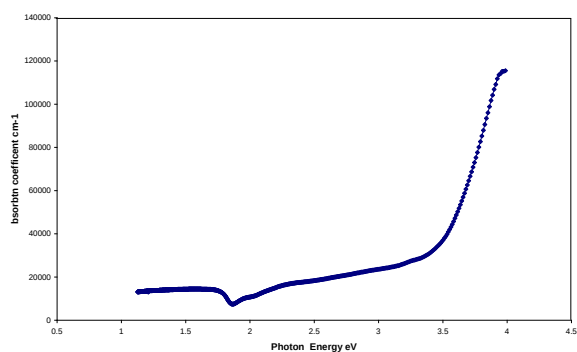
معامل الأمتصاص :

من معلومات أطياف الأمتصاصيه للأغشية المحضره تم حساب معامل الأمتصاص في منطقة الأمتصاص الأساسيه باستخدام قانون بير لامبرت [2,8] :

$$\ln(I_0 / I) = 2.303A = \alpha d$$

$$\alpha = 2.303 \frac{A}{d} \text{-----(1)}$$

حيث ان I_0 و I هي شدة الأشعه الساقطه والنافذه على التوالي , A امتصاصية الغشاء و α هو معامل الأمتصاص و d هو سمك الغشاء . الأشكال (11,12) تبين تغير معامل الأمتصاص مع طاقة الفوتون الساقط لأغشية NiO و CdS على التوالي . الأشكال تبين التغير البطيء لمعامل الأمتصاص في مدى الطاقات المنخفضه ثم تزداد قيم معامل الأمتصاص بشكل سريع بالقرب من حافة الأمتصاص الأساسيه لكلا الغشائين. ويمكننا ان نلاحظ ان قيم معامل الأمتصاص لكلا الغشائين أكبر من 10^5 cm^{-1} وهذا يشير الى ان الانتقالات الألكترونيه هي انتقالات مباشره . وان الأغشية ذات فجوة طاقه مباشره .



شكل(11) تغيير معامل الأمتصاص مع طاقة الفوتون لغشاء NiO .

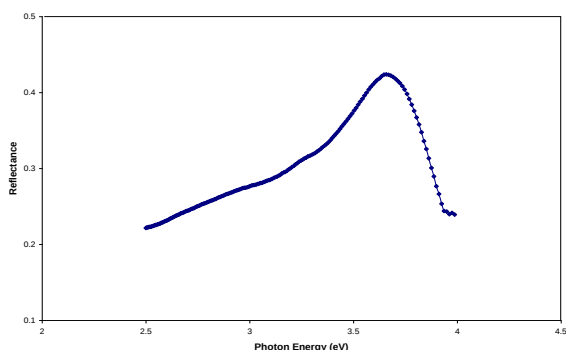
شكل (14) تغيير معامل الخمود مع طاقة الفوتون لغشاء CdS .

الأنعكاسية :

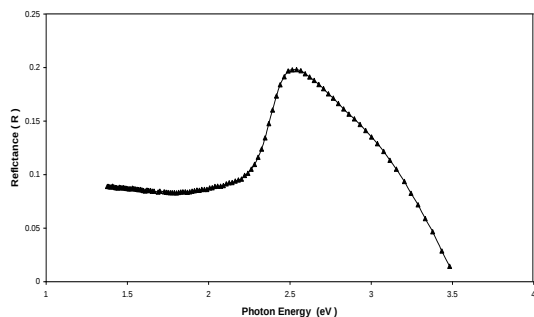
الأشكال (15,16) يبين أطيف الأنعكاسية البصريه لأغشية NiO و CdS على التوالي . الأنعكاسية وجدت باستخدام العلاقة الآتية:

$$R = 1 - A - T \quad \text{-----}(3)$$

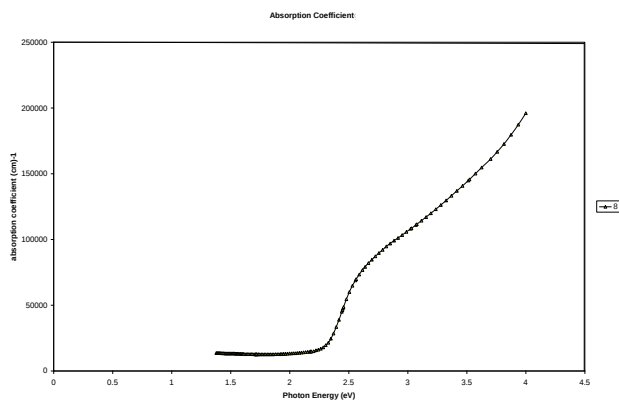
ومن خلال الأشكال نلاحظ ان الأنعكاسية تتزايد بشكل سريع عند الطاقات الواطئه و ثم تتكون ذروه (قمه) عند الطاقات المقابله لقيم طاقة الفجوه الممنوعه يليه انخفاض في انعكاسية الأغشية عند الطاقات الفوتونيه الأكبر من طاقة الفجوه الممنوعه . ويفسر ذلك على اساس ان الأمتصاص يكون مهماً او قليلاً جداً عند الطاقات الفوتونيه الأصغر من طاقة الفجوه الممنوعه يصاحب ذلك زياده في الأنعكاس عن سطح الغشاء وحسب العلاقة السابقه , وعندما تصبح طاقة الفوتون أكبر أو تساوي طاقة الفجوه الممنوعه تظهر قيمه واضحه للأمتصاص وتتزايد مما يسبب انخفاضاً ملحوظاً في أنعكاسية الأغشية [10,11].



شكل (15) تغير الأنعكاسية مع طاقة الفوتون لغشاء NiO



شكل (16) تغير الأنعكاسية مع طاقة الفوتون لغشاء CdS .



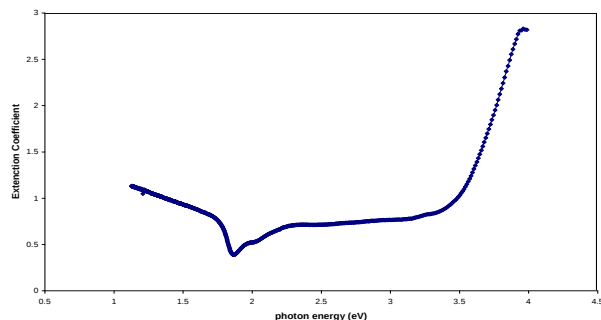
شكل (12) تغيير معامل الأمتصاص مع طاقة الفوتون لغشاء CdS .

معامل الخمود :

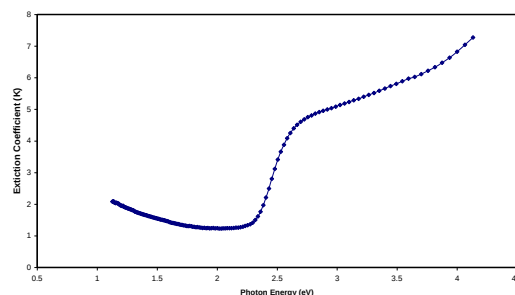
معامل الخمود k للأغشية المحضره حسب بأستخدام العلاقة الآتية [9,10]:

$$k = \frac{\alpha \lambda}{4\pi} \quad \text{-----}(2)$$

حيث أن λ هو الطول الموجي للفوتون الساقط . تغيير معامل الخمود كداله لطاقة الفوتون لأغشية CdS و NiO مبين بالأشكال (13,14) على التوالي, حيث أن معامل الخمود لأغشية NiO يمتلك قيم في المدى (0.395 – 2.829) , وقيم معامل الخمود لأغشية CdS هي في المدى (0.494 – 7.273) ونلاحظ ان سلوك معامل الخمود مشابه لسلوك معامل الأمتصاص لأعتماده بشكل كبير قيم معامل الأمتصاص كما مبين في المعادله (2) .



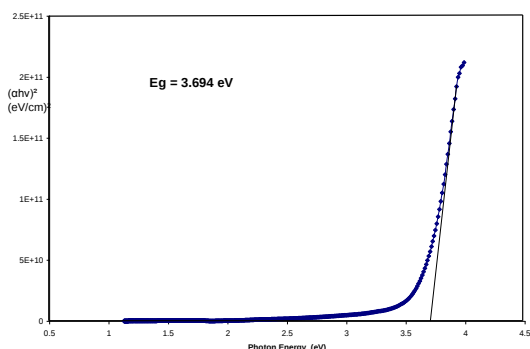
شكل (13) تغيير معامل الخمود مع طاقة الفوتون لغشاء NiO .



CdS (الأشكال 9,10) في مدى الأطوال اموجيه (300-1100)nm . تم التعرف على طبيعة الانتقالات الألكترونيه (مباشرة او غير مباشره) من خلال أستخدام العلاقة الآتيه [11,12]:

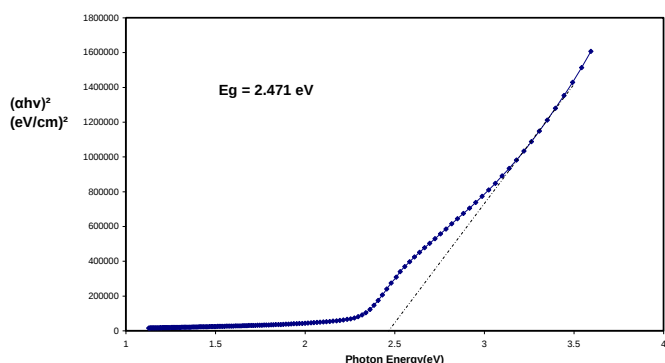
$$\alpha h\nu = A(h\nu - E_g)^n \text{ ----- (3)}$$

حيث ان $h\nu$ هي طاقة الفوتون و E_g هي طاقة الفجوه الممنوعه , A و n ثوابت . n تساوي 1/2 للانتقال المباشر المسموح وتساوي 2 للانتقال غير المباشر المسموح . الأشكال (19,20) تبين رسم العلاقة بين $(\alpha h\nu)^2$ وطاقة الفوتون $h\nu$ لأغشية NiO و CdS على التوالي . نلاحظ من الأشكال ان جزء من المنحني هو خط مستقيم أمتداده يقطع محور طاقة الفوتون عندما $(\alpha h\nu)^2$ يساوي صفر أي أن نقطة القطع تمثل قيمة طاقة الفجوه الممنوعه للانتقال المباشر المسموح . فمن الشكل (19) وجدت طاقة الفجوه الممنوعه لغشاء NiO تساوي (3.694 eV) وهي تتفق بشكل جيد مع قيمها للأغشية المحضرة بتقنيات مختلفه في المصادر [4,5] .



شكل (19) طاقة الفجوه الممنوعه للانتقال المباشر المسموح لغشاء NiO .

ومن الشكل (20) تم ايجاد قيمة طاقة الفجوه الممنوعه للانتقال الألكتروني المباشر المسموح لغشاء CdS وكانت تساوي (2.471eV) وهي تتفق بشكل جيد مع نتائج بحوث ودراسات عديده [6,7,14] .

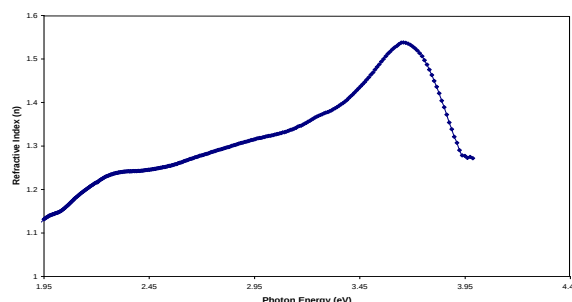


شكل (20) طاقة الفجوه الممنوعه للانتقال المباشر المسموح لأغشية CdS .

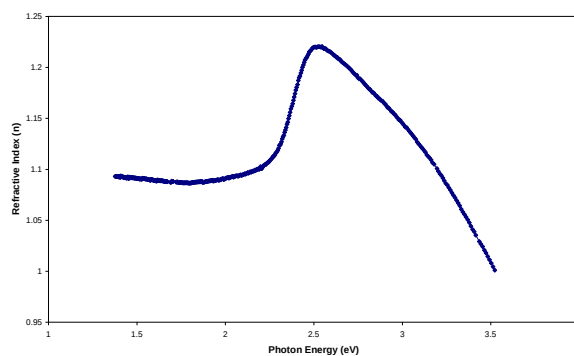
تم حساب معامل الانكسار للأغشية المحضره بأستخدام العلاقة الآتيه [12,13]:

$$n = \frac{1 + \sqrt{R}}{1 - \sqrt{R}} \text{ ----- (4)}$$

وتبين الأشكال (17,18) تغير معامل الانكسار مع طاقة الفوتون لأغشية NiO و CdS على التوالي , ومن خلال الأشكال نلاحظ التشابه الكبير في طبيعة هذه المنحنيات مع منحنيات الانعكاسيه وتغيرهما مع طاقة الفوتون . ان هذا التشابه قد يكون ناتج عن اعتماد حساب قيم معامل الانكسار بالدرجه الأساس على قيم الانعكاسيه وحسب المعادله (4) . كما نلاحظ وجود الذروه (القمه) في منحنيات معامل الانكسار عند الطاقات المقابله لطاقة الفجوه الممنوعه لكلا الغشائين .



شكل (17) تغير معامل الانكسار مع طاقة الفوتون لغشاء NiO .



شكل (18) تغير معامل الانكسار مع طاقة الفوتون لغشاء CdS .

طاقة الفجوه الممنوعه :

ان دراسة الأمتصاص البصري للمواد وحافة الأمتصاص الأساسيه لها يوفر لنا طريقه بسيطه للتعرف على بعض ميزات تركيب حزم الطاقه لتلك المواد . في هذا البحث تمت دراسة الأمتصاص البصري لأغشية NiO

[7]. A. ASHOUR , " Physical Properties of Spray Pyrolysed CdS Thin Films " , Turk. J. Phys., Vol. 27, 551 – 558 , 2003.

8. A. Ounissi , N. Ouddai , and S. Achour, " Optical characterization of chemically deposition $Pb_{(1-x)}Cd_xS$ films and a $Pb_{1-x}Cd_xS(n)/Si(p)$ heterojunction " , Eur. Phys. J. Appl. Phys. **37**, 241-245, 2007.

[9.] A.H. Clark," Polycrystalline and amorphous thin films and devices " , Academic press,1980 .

[10]. E.I.Ugwu and D.U.Onah," Optical characteristics of chemical path deposited CdS thin film characteristics with in UV, VIS, and NIR radiation " , The pacific journal of sciences and technology , **8**, 1, 155-161, 2007.

[11]. A.U.Ubale, V.S. Sangawar and D.K. Kulkarni," Size dependent optical characteristics of chemically deposited nanostructured ZnS thin films", Bull. Mater. Sci., **30**, 2, 147–151, 2007.

[12]. M.A. Al-Sabayleh , " The Effect of substrate temperature on the optical properties of spray deposited ZnS thin films prepared from non-aqueous media." , Umm Al-Qura Univ. J. Sci. Med. Eng., Vol.20, No.1,17-30, 2008 .

[13.] Ndukwe, I.C., " Solution growth, characterization and applications of Zinc sulphide thin films " , Sol. Ener. Mater. Sol. Cells ,Vol. 40, No.123 , 1996 .

[14]. M.D. Archbold1, D.P. Halliday1, K. Durose1, T.P.A. Hase1, D. Smyth-Boyle2, K. Govender, " Characterization of thin film cadmium sulfide grown using a modified chemical bath deposition process " , Conference record of the thirty – first IEEE photovoltaic specialists conference – 2005.

الاستنتاجات :

من خلال النتائج التي حصلنا عليها للخواص البصريه لأغشية NiO و CdS وتطابقها مع نتائج بحوث ودراسات عديده نستنتج ان المنظومه التي تم بناؤها لتحضير الأغشية الرقيقه للمواد الصلبه بتقنية الرش الكيميائي الحراري مفيدة وناجحه ومعتمده لتحضير أغشية رقيقه معتمده النتائج لأغراض البحوث والدراسات وصالحة لاستخدامها في تطبيقات متعددة .

شكر وتقدير :

يسرنا ان نتقدم بالشكر والتقدير لدائرة البحث والتطوير قسم رعاية العلماء والمبدعين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقيه لدعمها وتمويلها البحث والدراسه وبناء المنظومه بكل تفاصيلها .

المصادر :

References

- [1]K. wasa, M.Kitabatake, H.Adachi," Thin Film Material Technology", William Andrew, Inc., Japan , 2004 .
- [2]. M.Y. Nadeem, W. Ahmed , " Optical Properties of ZnS Thin Films " , Turk J Phy, Vol.24, 651 – 659, 2000 .
- [3.] Hao-Long Chena, Yang-Ming Lub, Weng-Sing Hwang, " Characterization of sputtered NiO thin films " , Surface & Coatings Technology, Vol. 198 ,138–142, 2005 .
- [4]. Sheng-Hui Lin , Fu-Rong Chen , Ji-Jung Kai , " Electrochromic properties of nano-structured nickel oxide thin film prepared by spray pyrolysis method " , Applied Surface Science , Vol. 254 , 2017–2022 , 2008 .
- [5]. Romana Cerc Korošec and Peter Bukovec , " Sol-Gel Prepared NiO Thin Films for Electrochromic Applications " , Acta Chim. Slov.,Vol. 53, 136–147, 2006.
- [6]. P. P. Sahay, R. K. Nath, and S. Tewari , " Optical properties of thermally evaporated CdS thin films " , Cryst. Res. Technol. Vol.42, No. 3, 275 – 280 , 2007 .